

Приставки и принадлежности к ИКФС Инфраспек

Приставки отражения



Приставка зеркального отражения ПЗО10

Приставка зеркального отражения с углом падения луча 10°. Применяется для измерения отражающей способности твердых образцов и для анализа покрытий.



Приставки зеркального отражения ПЗО30 и ПЗО45

Приставки зеркального отражения с углом падения луча соответственно 30° и 45°. Применяются для рутинных измерений образцов, имеющих покрытие в микронном диапазоне, с целью идентификации покрытий и определения их толщины.



Приставка зеркального отражения ПЗО80

Приставка со «скользящим» углом падения луча — 80°. Применяется для измерения тонких покрытий, имеющих толщину в нанометровом диапазоне, и мономолекулярных слоёв.



Приставка диффузного отражения PDO

Диффузное отражение — это высокочувствительный метод для анализа порошкообразных и твердых образцов, не требующий трудоемкой пробоподготовки.



Приставка МНПВО36 горизонтального типа

Метод МНПВО (многократного нарушенного полного внутреннего отражения) позволяет проводить экспресс-исследования химического состава жидких сред, мелкодисперсных неабразивных порошков и полимерных пленок, не требует трудоемкой пробоподготовки.

ИК-Микроскоп



Микроскоп инфракрасный МИК15 является приставкой к фурье-спектрометрам серии ФСМ и предназначен для исследования микрообразцов и микрообластей в неоднородных образцах. С его помощью можно получать ИК-спектры пропускания и отражения для областей размером 300 мкм и менее.



Особенности и преимущества

- Может работать в режимах пропускания и отражения.
- Предметный столик двухкоординатный, ручной.
- Визуальный контроль образца с помощью бинокулярной насадки, согласованной с объективом микроскопа.

Технические характеристики МИК15

Отношение сигнал/шум (режим пропускания область 0,3 мм разрешение 8 см^{-1} , время накопления 1 мин.	800
Объектив	Кассегрен x15, зеркальный
Минимальный размер области исследования, мкм	20
Детектор	LiTaO ₃
Габаритные размеры, мм	430 x 280 x 150
Масса, кг	8

Специальные приставки



Приставки для пластин кремния

Предназначены для контроля параметров полупроводниковых пластин диаметром до 200 мм в режиме пропускания или отражения.



Приставка-автосамплер для анализа бензинов

Приставка предназначена для определения концентрации бензола и оксигенатов в бензине.



Приставка для БИК-анализа

Предназначена для исследования порошков, измельченных и волокнистых материалов в БИК-области спектра со спектрометром ФСМ 2211.

Кроме того, вы можете найти у нас жидкостные и газовые кюветы, все виды держателей для образцов разного типа и традиционное вспомогательное оборудования, применяемое в инфракрасной Фурье-спектроскопии.

По всем вопросам обращайтесь: [ТОО «Bio Engineering Group»](#)

г. Нур-Султан, Казахстан

e-mail: info@bioegroup.kz,

тел.: +7 7172 529 639

Контакт в Алматы: тел.: +7 777 234 6774